

日本信頼性学会
日本信頼性学会第45回年次総会及び
第31回春季信頼性シンポジウムプログラム

2023年6月1日現在

対面とオンラインのハイブリッド開催（日科技連東高円寺ビルとMicrosoft Teams）

日時：2023年6月1日（木）10：30～17：50

（敬称略）

発表25分バージョン	
10:30～11:30	日本信頼性学会第45回年次総会
11:30～11:45	授 賞 式
11:45～13:00	昼食休憩
12:55～13:00	開会挨拶
	特別講演 司会：根本
13:00～14:30	「ミニマルファブがもたらす半導体の信頼性技術」 原 史朗 氏 （一般社団法人ミニマルファブ推進機構 推進部長 兼 ファブシステム研究会 代表 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 首席研究員）
14:30～14:40	休憩
	セッション1【試験，故障解析，部品，要素技術の信頼性，ハードウェア面】司会：高橋、補助：根本
14:40～15:05	耐湿，腐食，ECM試験を故障メカニズムから一考察 ○伊藤 貞則（イトケン事務所）
15:05～15:30	軌道上における錫ウィスカ成長特性及び抑制対策の評価 ○市丸 慎一郎、中川 剛、根本 規生、中村 裕広（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構）、 菅沼 克昭、西川 宏（大阪大学）
15:30～15:55	積層セラミックコンデンサ代替品使用条件検討 ○久保田 一成（㈱タムラ製作所）
15:55～16:05	休憩
	セッション2【安全性，リスク】司会：岩田、補助：遠藤
16:05～16:30	鉄道の自動運転GoA3・GoA4に使用する車上カメラ・センサ類の安全性水準のあり方に関する考察 ○押立 貴志、工藤 希（交通安全環境研究所）、渡邊 翔一郎（東京電機大学）
16:30～16:55	事象の生起順序に依存するハザードのFTA ○柴垣 光男（日本信頼性学会要素技術安全研究会）
16:55～17:20	機能安全と総合信頼性/リスクメトリック -包括的SIL（H-SIL）について- 川島 興（オリエンタルモーター㈱）、○佐藤 吉信（(公財)医療の質向上研究所）
17:20～17:45	CO ₂ センサを用いたフィールドワークと時系列データ解析に基づくエアロソール感染リスク診断 川内 雄登、○横川 慎二、石垣 陽（電気通信大学）
17:45～17:50	終わりの挨拶